

## SEM観察の基礎

### 試料前処理～試料導入、観察条件設定～基本操作 異物分析 について

走査電子顕微鏡（SEM）は、フォーカスやスティグマなどをオートで調整する機能の性能が飛躍的に向上し、簡単にSEM像が取得ができるようになりました。そして、現場レベルでは異物分析の需要が高まっています。しかし、サンプルからの情報を的確に捉えるためには、観察される目的に合ったサンプルの前処理や最適な観察条件に調整する必要があります。

本セミナーでは、普段SEMをご使用いただいているお客様、主に異物分析をされている方々にサンプルに応じた前処理から観察条件の設定について、卓上型SEMを用いてご紹介させていただきます。

本セミナーは、WEB上で開催されます。WEBに接続できる環境であれば、パソコンからだけでなく、スマートフォンやタブレットからも参加することができます。皆さまのご参加をお待ちしております。

#### 【このウェビナーから学べること】

- ・ SEMの基本操作について
- ・ 観察条件に関する基本ノウハウ
- ・ 異物分析アプリケーションご紹介

#### 【参加いただきたいお客様】

- ・ これからSEMを使用される初心者のお客様
- ・ 試料作成等の前処理について知りたいお客様
- ・ 異物分析でお困りのお客様

#### 開催日

**2025年12月12日（金）**  
**13：30～14:30**

#### 参加費

##### 無料

※先着順での受付となります。  
お早めにお申し込みください

#### ★ お申込み方法

参加をご希望のお客様は、「SEM観察の基礎」参加希望と下記Mailアドレスに連絡ください。後日、参加用のURLを送信いたします。  
その際事前アンケートにご回答いただきますと幸いです。

##### <事前アンケート>

- 1,現在お使いの電子顕微鏡はありますか？
- 2,よろしければ装置名を教えてください。
- 3,装置の新規導入または更新のご予定はありますか？
- 4,事前にご要望・ご質問などありましたらご記入ください。ウェビナー講演後に回答します。
- 5,今後どのような内容のものを受講したいと思いませんか？
- 6,その他、ご意見・ご質問などがございましたらお聞かせください。

#### ★ お問い合わせ先

株式会社東栄科学産業

022-743-3221

担当 河内（かわち） 木村（きむら）

mail:sale12@toei-tc.co.jp



卓上型SEM JCM7000



株式会社東栄科学産業

Toei Scientific Industrial Co.,Ltd